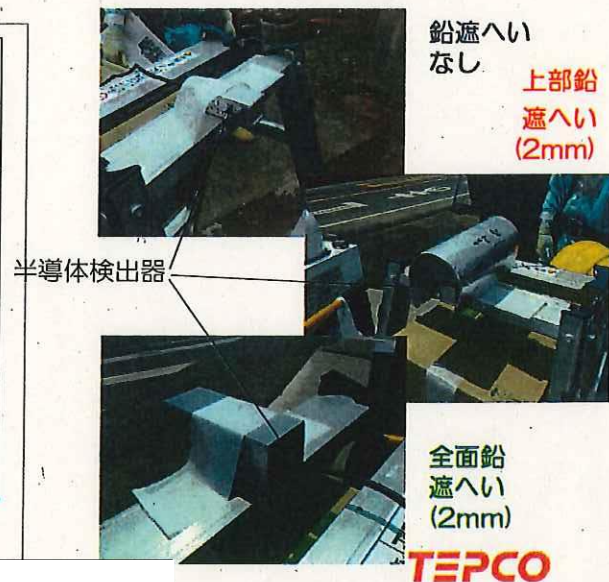
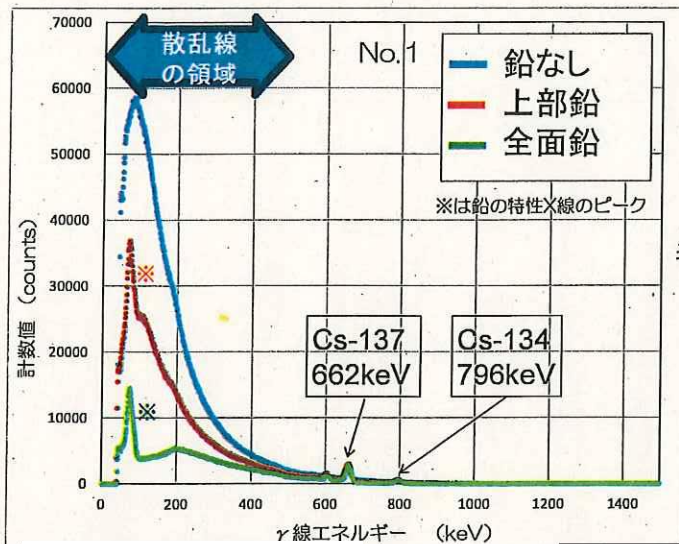


3号機周辺の γ 線スペクトル測定結果(1/2)

H28.7.6

□ (目的) P29に示した3号機周辺(測定点No.1~5)の地上面の線量率の低下が、散乱線の寄与によるものかどうか確認するため、半導体検出器を使用して、 γ 線スペクトル測定を実施(5月24日測定、各5分間測定)。また、散乱線を遮へいする厚さ2mmの鉛遮へいを検出器に被せて、その差から散乱線の寄与を評価(鉛遮へいなし(青のスペクトル)と全面鉛遮へい(緑のスペクトル)のスペクトル面積差)。

□ (結果) いずれの測定点においてもCsの光電ピークよりも散乱線の領域のスペクトルが大きく、スペクトル面積差による評価は、散乱線の寄与がスペクトル全体の8割以上を占めている。このことから、3号機周辺の線量率の低下は、A工区遮へい設置により散乱線の寄与が低減したことによるものと推定。

3号機周辺の γ 線スペクトル測定結果(2/2)